

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: 10

Type: Non spécifié

Simulation and characterization of HV/HR-CMOS sensors for radiation hardness

jeudi 16 juin 2016 13:30 (30 minutes)

Orateur: Dr BENOIT, Mathieu (CERN)